



900V Cascode GaN FET in TO-247 (source tab)

产品说明

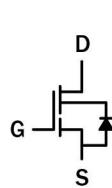
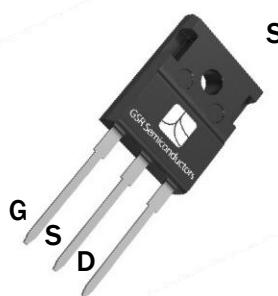
GSR900D035A系列 900V、50mΩ 氮化镓 (GaN) FET 开关型器件。它结合最先进的高压GaNHEMT 与低压硅 MOSFET来提供卓越的可靠性和安全性能。

通过更低的栅极电荷、更低的交叉损耗和更小的反向恢复电荷提供比硅更高的效率。

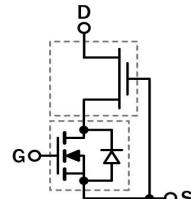
订购信息

器件编号	封装	封装配置
GSR900D035A	3 lead TO-247	Source

GSR900D035A
TO-247
(top view)



Cascode 示意图符号



Cascode 器件结构

产品特征

- 通过JEDEC认证的氮化镓技术
- 动态导通电阻生产测试
 - 稳健的设计，定义为
 - 固有寿命测试
 - 宽棚安全裕度
 - 瞬态过压能力
- 极低的QRR
- 减少交叉损耗
- 符合 RoHS 标准和无卤封装

产品优点

- 启用图腾柱无桥PFC设计
 - 提高功率密度
 - 减小系统尺寸和重量
 - 整体系统成本更低
- 提高了硬开关和软开关电路的效率
- 使用常用的栅极驱动器易于驱动
- GSD引脚布局改进了高速设计

产品应用

- 数据通信
- 广泛的工业应用
- 光伏逆变器
- 伺服电机应用

Key Specifications

V_{DS} (V)	900
$V_{(TR)DSS}$ (V) max	1000
$R_{DS(on)eff}$ (mΩ) max*	63
Q_{RR} (nC) typ	156
Q_G (nC) typ	15

* 动态导通电阻；；参见图 18 和 19



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

绝对最大额定值($T_J=25^{\circ}\text{C}$ 除非另有说明)

Symbol	Parameter	Limit Value	Unit
I_D	Continuous drain current @ $T_c=25^{\circ}\text{C}$ ^a	34	A
	Continuous drain current @ $T_c=100^{\circ}\text{C}$ ^a	22	A
I_{DM}	Pulsed drain current (pulse width: 10μs)	150	A
di/dt_{RDMC}	Reverse diode di/dt , repetitive ^b	1600	A/μs
I_{RDMC1}	Reverse diode switching current, repetitive (dc) ^c	24	A
I_{RDMC2}	Reverse diode switching current, repetitive (ac) ^c	28	A
di/dt_{RDMT}	Reverse diode di/dt , transient ^d	3000	A/μs
I_{RDMT}	Reverse diode switching current, transient	36	A
$V_{(TR)DSS}$	Transient drain to source voltage ^e	1000	V
V_{GSS}	Gate to source voltage	±20	V
P_D	Maximum power dissipation @ $T_c=25^{\circ}\text{C}$	119	W
T_c	Operating temperature	Case	$^{\circ}\text{C}$
T_J		Junction	$^{\circ}\text{C}$
T_s	Storage temperature	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$
T_{SOLD}	Soldering peak temperature ^f	260	$^{\circ}\text{C}$
-	Mounting Torque	80	N cm

Notes:

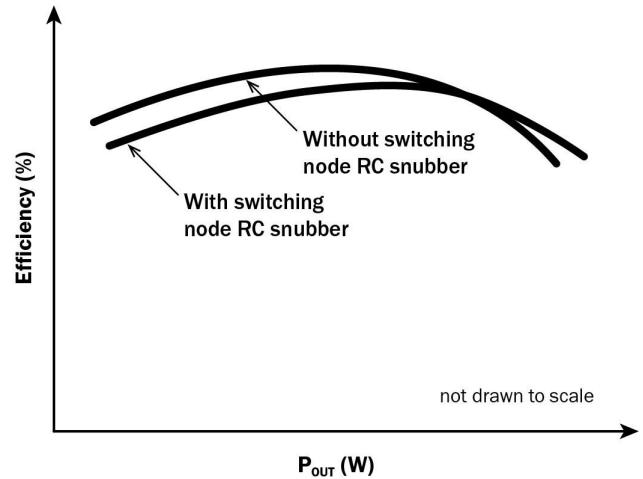
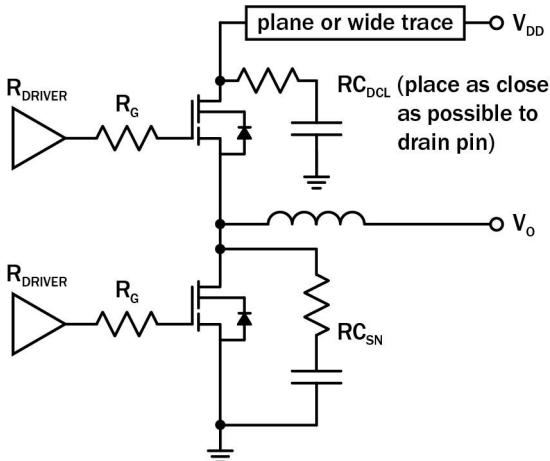
- a. 连续开关操作
- b. 定义: dc = DC to DC 转换器拓扑结构; ac = 逆变器和 PFC 拓扑, 50-60Hz 线路频率
- c. 1 秒内 <300 个脉冲
- d. 关断状态下, 尖峰占空比 $D < 0.01$, 尖峰持续时间 <1μs
- e. 10 秒, 距离表壳 1.6mm
- f. 如需在大电流操作下提高稳定性, 请参见第三页电路实现

热阻

Symbol	Parameter	Typical	Unit
$R_{\theta JC}$	Junction-to-case	1.05	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient	40	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$



电路实现



简化半桥示意图

输出功率

推荐的栅极驱动: ($OV, 12-14V$) with $R_{G(tot)} = 22-30\Omega$, $R_{G(tot)} = R_G + R_{DRIVER}$

Required DC Link RC Snubber (RC_{DCL}) ^a	Recommended Switching Node RC Snubber (RC_{SN}) ^b
$[10nF + 8\Omega] \times 2$	$100pF + 10\Omega$

Notes:

- a. RC_{DCL} 应尽可能靠近漏极引脚
- b. 对于高开关电流 ($> I_{RDMC1}$ 或 I_{RDMC2} 的 70%), 建议使用开关节点 RC 缓冲器 (C、R)



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

电气参数 ($T_J=25^\circ\text{C}$ 除非另有说明)

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
Forward Device Characteristics						
$V_{(\text{BL})\text{DSS}}$	Maximum drain-source voltage	900	—	—	V	$V_{\text{GS}}=0\text{V}$
$V_{\text{GS}(\text{th})}$	Gate threshold voltage	3.4	3.9	4.4	V	
$\Delta V_{\text{GS}(\text{th})}/T_J$	Gate threshold voltage temperature coefficient	—	-6.5	—	mV/ $^\circ\text{C}$	$V_{\text{DS}}=V_{\text{GS}}, I_D=0.7\text{mA}$
$R_{\text{DS}(\text{on})\text{eff}}$	Drain-source on-resistance ^a	—	50	63	m Ω	$V_{\text{GS}}=10\text{V}, I_D=22\text{A}$
		—	105	—		$V_{\text{GS}}=10\text{V}, I_D=22\text{A}, T_J=150^\circ\text{C}$
I_{DSS}	Drain-to-source leakage current	—	4	40	μA	$V_{\text{DS}}=900\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V}$
		—	15	—		$V_{\text{DS}}=900\text{V}, V_{\text{GS}}=0\text{V}, T_J=150^\circ\text{C}$
I_{GSS}	Gate-to-source forward leakage current	—	—	100	nA	$V_{\text{GS}}=20\text{V}$
	Gate-to-source reverse leakage current	—	—	-100		$V_{\text{GS}}=-20\text{V}$
C_{ISS}	Input capacitance	—	1000	—	pF	
C_{OSS}	Output capacitance	—	115	—		$V_{\text{GS}}=0\text{V}, V_{\text{DS}}=600\text{V}, f=1\text{MHz}$
C_{RSS}	Reverse transfer capacitance	—	3.5	—		
$C_{\text{O(er)}}$	Output capacitance, energy related ^b	—	153	—	pF	
$C_{\text{O(tr)}}$	Output capacitance, time related ^c	—	260	—		$V_{\text{GS}}=0\text{V}, V_{\text{DS}}=0\text{V to } 600\text{V}$
Q_G	Total gate charge	—	15	—	nC	
Q_{GS}	Gate-source charge	—	5	—		$V_{\text{DS}}=600\text{V}, V_{\text{GS}}=10\text{V}, I_D=22\text{A}$
Q_{GD}	Gate-drain charge	—	4.7	—		
Q_{OSS}	Output charge	—	155	—	nC	$V_{\text{GS}}=0\text{V}, V_{\text{DS}}=0\text{V to } 600\text{V}$
$t_{\text{D(on)}}$	Turn-on delay	—	48	—	ns	
t_R	Rise time	—	12	—		
$t_{\text{D(off)}}$	Turn-off delay	—	70	—		$V_{\text{DS}}=600\text{V}, V_{\text{GS}}=10\text{V}, I_D=22\text{A}$
t_F	Fall time	—	12	—		$R_G=25\Omega, 4\text{A driver}$
Reverse Device Characteristics						
I_s	Reverse current	—	—	22	A	$V_{\text{GS}}=0\text{V}, T_c=100^\circ\text{C}, \leq 25\% \text{ duty cycle}$
V_{SD}	Reverse voltage ^a	—	2.2	2.6	V	$V_{\text{GS}}=0\text{V}, I_s=22\text{A}$
		—	1.6	1.9		$V_{\text{GS}}=0\text{V}, I_s=11\text{A}$
t_{RR}	Reverse recovery time	—	53	—	ns	$I_s=22\text{A}, V_{\text{DD}}=600\text{V}, \frac{di}{dt}=1000\text{A}/\mu\text{s}$
Q_{RR}	Reverse recovery charge	—	156	—	nC	

Notes:

- a. 动态导通电阻;有关测试电路和条件,请参见图 14 和图 15
- b. 当 V_{DS} 从 0V 上升到 600V 时,提供相同存储能量的等效电容
- c. 当 V_{DS} 从 0V 上升到 600V 时,提供相同充电时间的等效电容



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

典型特性 ($T_c=25^\circ\text{C}$ 除非另有说明)

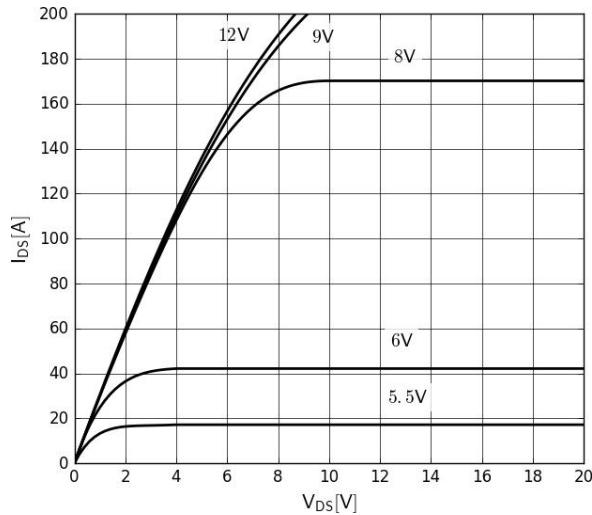


图1. 典型输出特性 $T_j=25^\circ\text{C}$

Parameter: V_{GS}

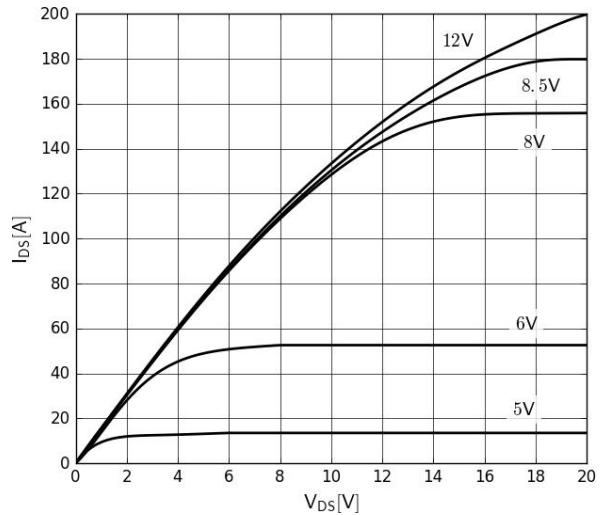


图2. 典型输出特性 $T_j=150^\circ\text{C}$

Parameter: V_{GS}

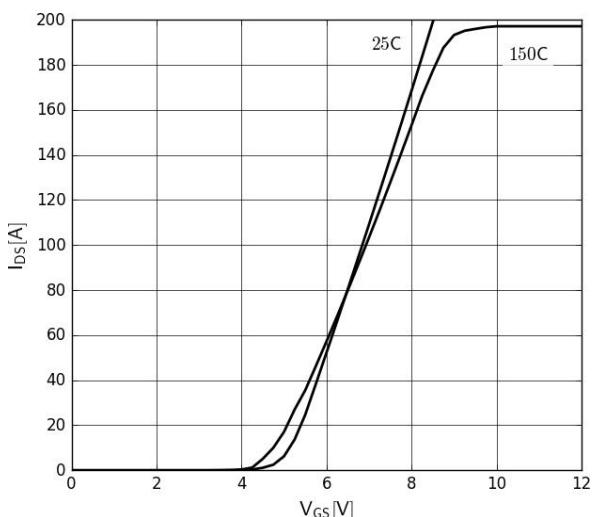


图3. 典型的转移特性

$V_{DS}=20\text{V}$, parameter: T_j

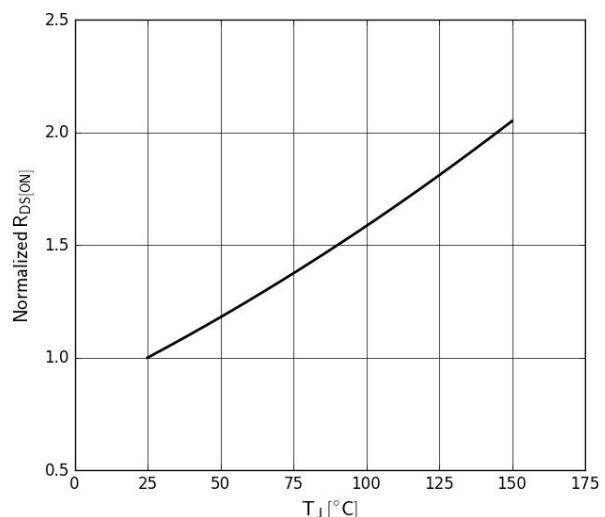


图4. 标准化电阻

$I_D=22\text{A}$, $V_{GS}=8\text{V}$



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

典型特性

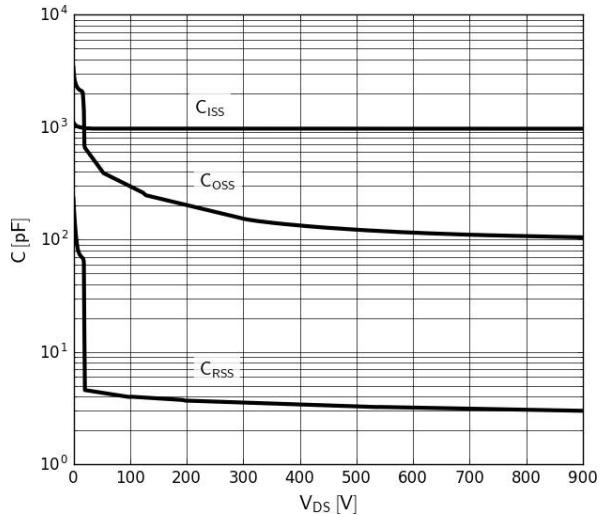


图 5. 典型电容

$V_{GS}=0V, f=1MHz$

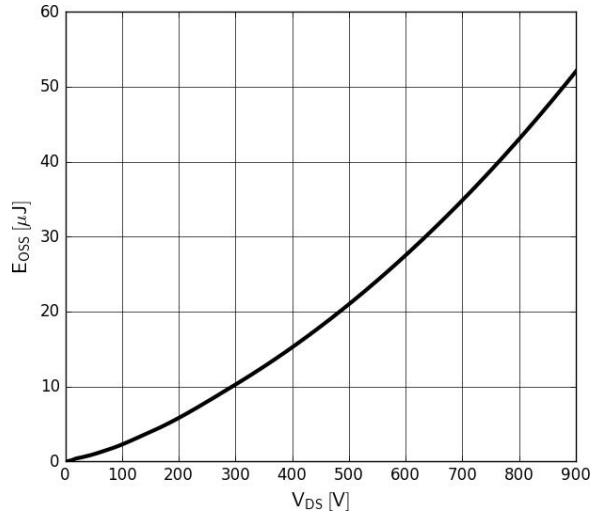


图 6. 典型COSS存储能量

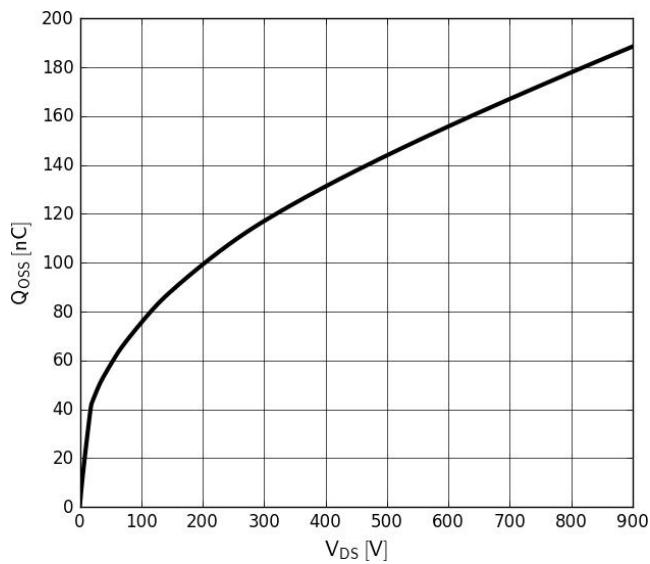


图 7. 典型QOSS

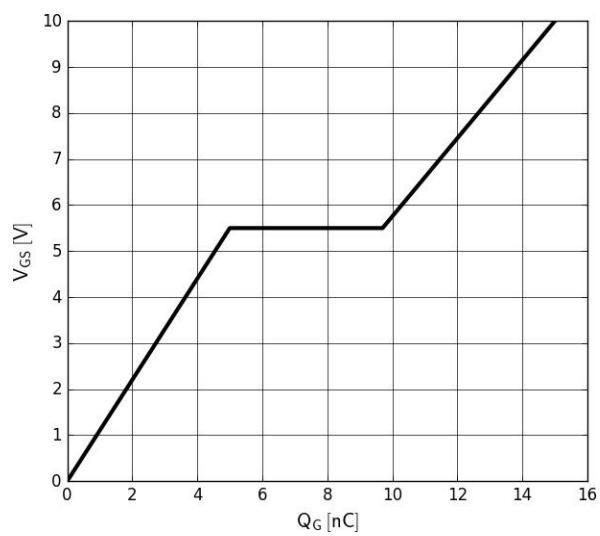


图 8. 典型阈值电荷

$I_{DS}=22A, V_{DS}=600V$



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

典型特性

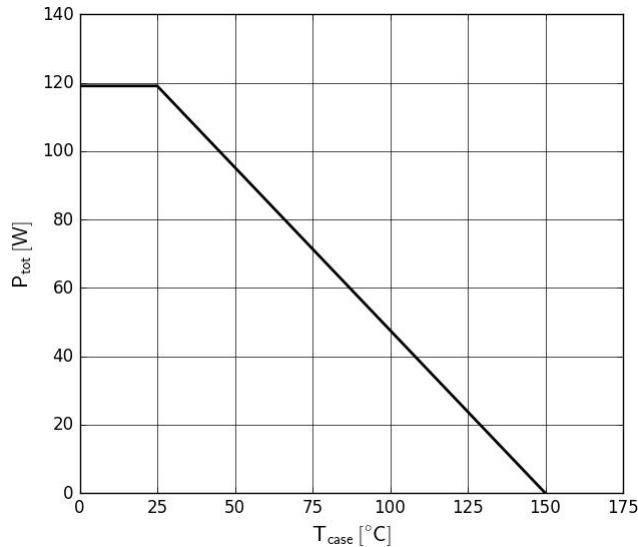


图 9. 功率损耗

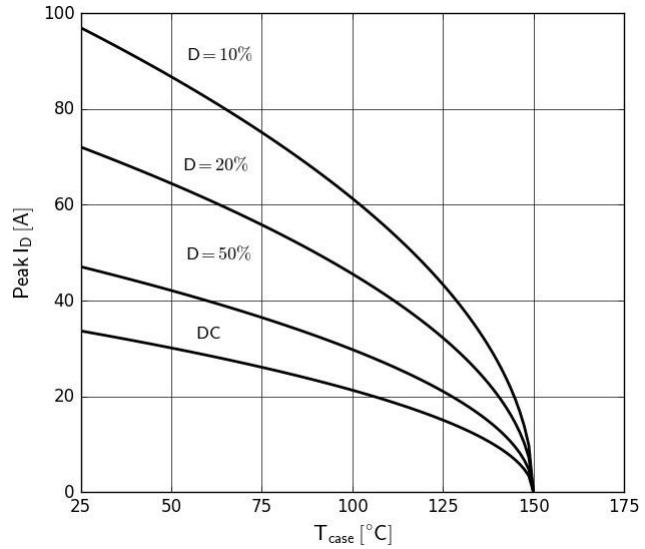


图 10. 电流降额
Pulse width $\leq 10\mu s$, V^{GS} $\geq 10V$

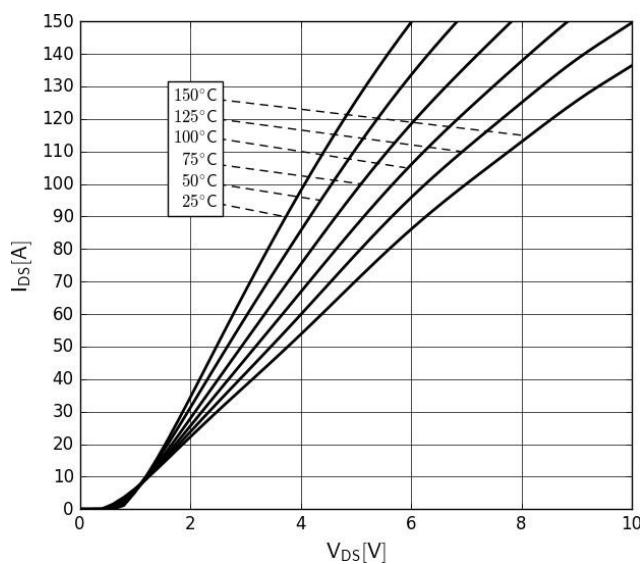


图 11. Rev的正向特征
IS=f(VSD), parameter: TJ

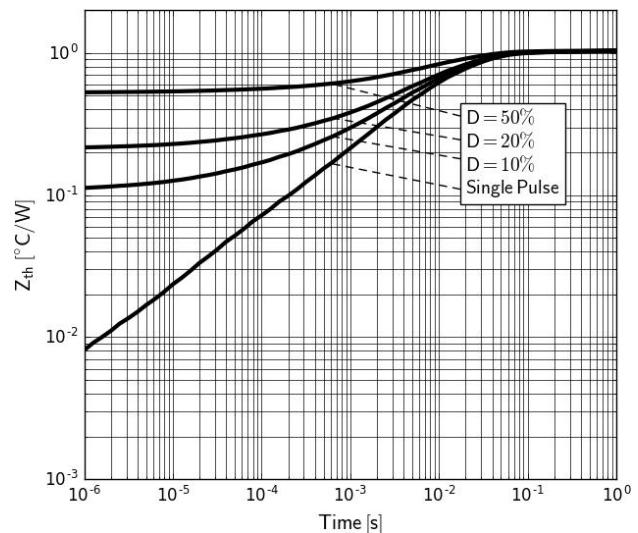


图 12. 瞬态



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

典型特性 ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

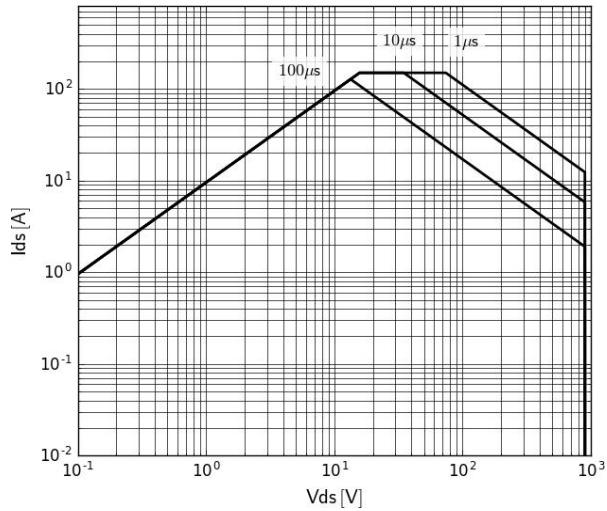


图 13. 安全工作区 $T_c=25^\circ\text{C}$



测试电路和波形

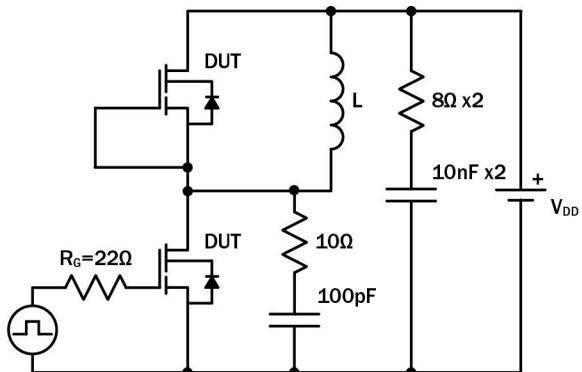


图 14. 开关时间测试电路

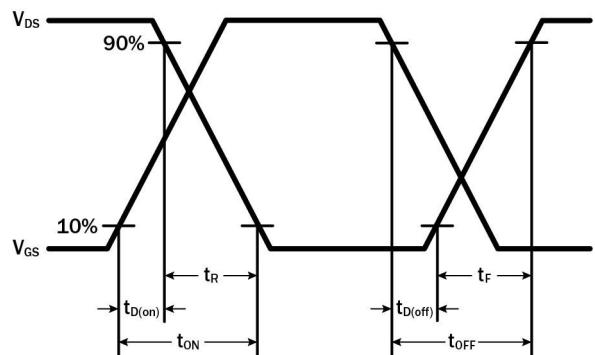


图 15. 开关时间波形

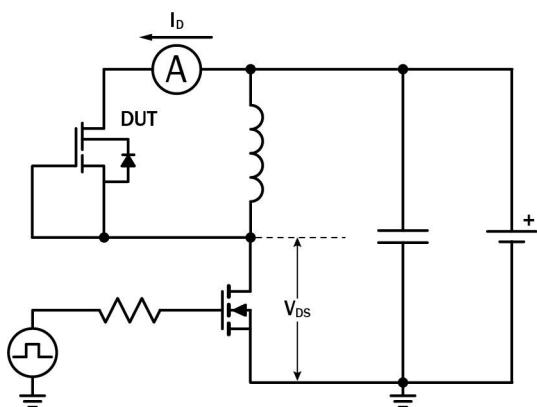


图 16. 二极管特性测试电路

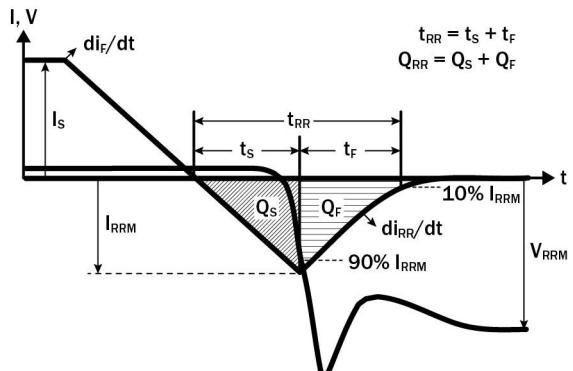


图 17. 二极管恢复波形

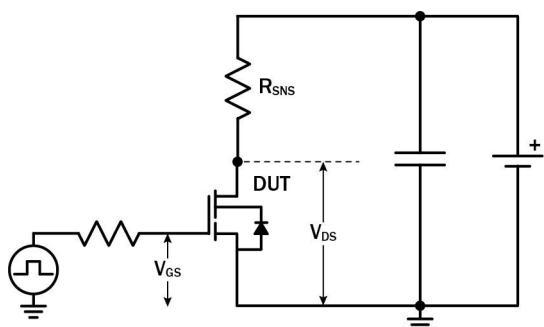


图 18. 动态 RDS(on)eff 测试电路

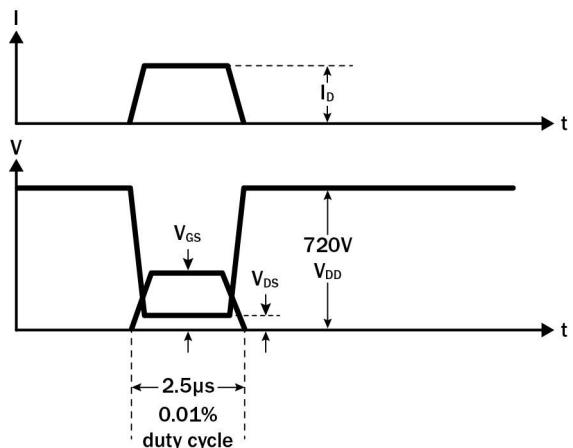


图 19. 动态 RDS(on)eff 波形



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

设计注意事项

GaN 器件的快速开关降低了电流-电压交越损耗，可实现高频、高效率操作。但是，充分利用 GaN 开关的快速开关特性需要遵守特定的 PCB 布局指南和探测技术。

评估 GaN 器件时：

DO	DO NOT
通过在驱动和电源环路中保持走线短，最大限度地降低电路电感	扭动 TO-220 或 TO-247 的引脚以适应 GDS 电路板布局
安装到 PCB 时，将 TO-220 和 TO-247 封装的引线长度降至最低	在驱动电路中使用长走线，器件的引线长度过长
使用最短检测环路进行探测；将探头及其接地连接直接连接到测试点	使用差模探头或带长线的探头接地夹



徐州金沙江半导体
Xuzhou GSR Semiconductor

GSR900D035A

